

ICT [In-Circuit-Test]

Der ICT ist ein Adapter basierendes Prüfverfahren in der Elektronikfertigung. Durch Prüfnadeln mit verschiedensten Kopfformen werden im Idealfall alle Knoten einer Schaltung angetastet. Die Kontaktierung erfolgt auf Prüfpunkte, auf THT-Pins oder über Steckverbinder. Durch das Stimulieren der Knoten mit Strom und Spannung können alle passiven und aktiven konventionelle Bauelemente auf Ihre Funktion und ihre elektrischen Kennwerte überprüft werden. Für integrierte Schaltkreise (IC) wird ein vektorloses Verfahren das Chip Scan eingesetzt. Bei diesem Verfahren wird über parasitäre Eigenschaften der ICs das Vorhandensein der Eingangsschutzdioden nachgewiesen und somit die elektrische Kontaktierung der Pins mit der Leiterplatte nachgewiesen.

